**Фигуров, Валерий Сергеевич. Прогнозирование показателей стойкости изделий полупроводниковой электроники к воздействию импульсных ионизирующих излучений по результатам испытаний : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.05, 05.27.01 / Моск. гос. инженерно-физ. ин-т.- Москва, 2000.- 24 с.: ил. РГБ ОД, 9 00-5/2178-5**